

表面波探査の測定と解析

McSEIS-SXW

&

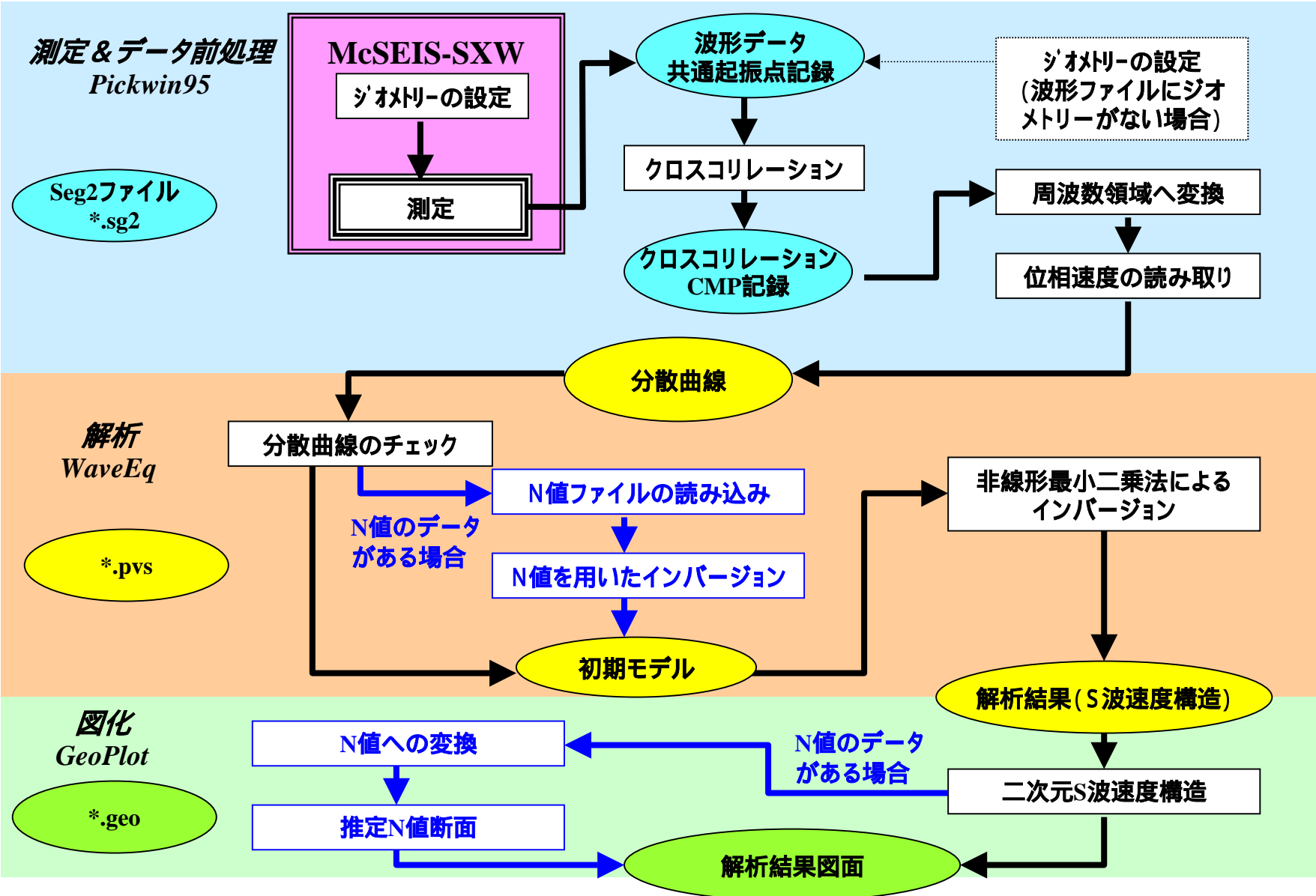
SeisImager/SW

応用地質株式会社

測定と解析の概要

- 表面波探査の測定と解析は、McSEIS-SXW上で作動する「SeisImager/SW」を用いて行います。
- 測線ID
メニューにしたがった測定・解析を行う場合、その経過は、1つの測線の固有の「測線ID」によってまとめられます。測線IDは「aa」～「zz」となります。

測定・解析の流れ(二次元探査)



測定・解析メニュー

1. 現場における自動解析
SXWで全ての測定・解析を行います。測定・解析はメニューにしたがって行います。
2. PCを用いた自動解析
SXWで測定したデータをPCで解析します。測定・解析はメニューにしたがって行います。
3. マニュアル解析
SXWや他の測定器で測定したデータを、メニューを用いずマニュアルで解析します。

使用するファイル

- 「**」は測線ID、「\$\$\$\$」は波形ファイルのIDです。メニューに従って測定・解析を行う場合は、下記の様に自動的に名前がつきます。
- ファイルリスト(プロジェクトファイル)
*SX****.xml***
測線および解析の情報をまとめるファイルです
- 波形データファイル(SEG2フォーマット)
*SX**\$\$\$\$**.sg2***
1起振毎の波形が保存されます
- 分散曲線のファイル
*SX****.pvs***
*SX****_analysis_result.pvs***
解析途中段階の分散曲線および解析結果(S波速度構造)が保存されます
- 解析結果図面ファイル
*SX****.geo***
解析結果図面が保存されます